



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108398448 A

(43)申请公布日 2018.08.14

(21)申请号 201810366330.0

(22)申请日 2018.04.23

(71)申请人 浙江工业大学

地址 310014 浙江省杭州市下城区朝晖六
区潮王路18号

(72)发明人 乐孜纯 董文

(74)专利代理机构 杭州斯可睿专利事务有限
公司 33241

代理人 王利强

(51)Int.Cl.

G01N 23/223(2006.01)

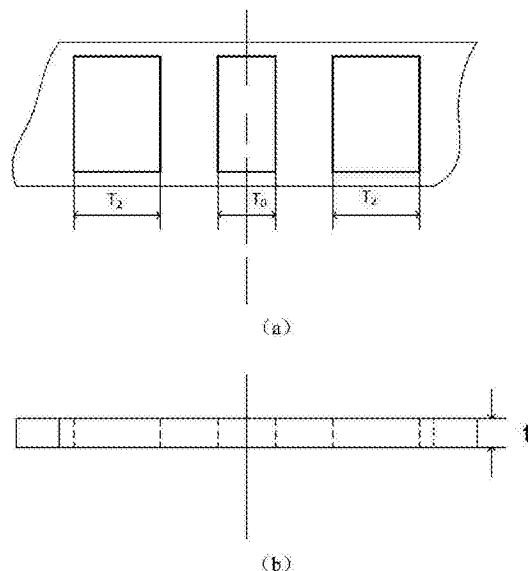
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑

(57)摘要

一种用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,所述X射线光阑包括整形部分和滤波部分,所述整形部分是指利用X射线光阑结构阻隔射入X射线阵列组合折射透镜之外的杂散光并对光束进行初步准直的结构;所述滤波部分是指X射线光阑结构中透光带和阻光带交替布置的滤波结构,并通过滤波结构将X射线光波分裂成多个子光束。本发明应用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件,可同时实现高微区分辨率和高灵敏度,并可进行现场分析。



1. 一种用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,其特征在于:所述X射线光阑包括整形部分和滤波部分,所述整形部分是指利用X射线光阑结构阻隔射入X射线阵列组合折射透镜之外的杂散光并对光束进行初步准直的结构;所述滤波部分是指X射线光阑结构中透光带和阻光带交替布置的滤波结构,并通过滤波结构将X射线光波分裂成多个子光束。

2. 如权利要求1所述的用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,其特征在于:所述透光带的数目为(M+1)个,与所述X射线阵列组合折射透镜中组合折射透镜的数目相同。

3. 如权利要求2所述的用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,其特征在于:所述透光带和阻光带的宽度分别由下列公式计算得出:

零级透光带 T_0 ,与X射线组合折射透镜的数值口径尺寸相同,正负一级透光带、正负二级透光带...,依此类推,透光带宽度表示为:

$$T_M = \frac{T_0}{\cos(0.5M\theta)} \quad (1)$$

θ 为X射线阵列组合折射透镜的光轴与阵列中的正负一级X射线组合折射透镜的光轴夹角;

正负一级阻光带、正负二级阻光带...,依此类推,阻光带宽度表示为:

$$G_M = L \cdot \tan(0.5M \cdot \theta) \quad (2)$$

其中L代表X射线组合折射透镜的几何长度,表示为 $L = N \cdot l$,其中l为折射单元轴向厚度尺寸。

4. 如权利要求1或2所述的微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,其特征在于,所述X射线光阑选择吸收特性满足下列公式的任何材料,

$$\text{X射线波段材料的吸收系数: } \beta = \sum_i \frac{N_A r_0 \lambda^2}{2\pi} \frac{f_2}{A_i} \rho_i \quad (3)$$

其中 N_A 代表阿伏伽德罗常数, r_0 代表电子半径, λ 代表波长,A代表原子质量, f_2 代表原子散射因子, ρ 代表电子密度,下标i代表化合物中的元素种类,当材料为单质是 $i=1$;

所述X射线光阑的材料厚度t满足表达式 $e^{-\beta \cdot t} < 1$ 。

用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑

技术领域

[0001] 本发明涉及X射线探测和成像领域,尤其是一种用于微束X射线荧光分析系统的X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑。

背景技术

[0002] X射线荧光(XRF,X-Ray Fluorescence)分析系统能在常压下对各种形态(固态/液态/粉末等)样品进行简单快速、高分辨率和无损的元素定量测量分析。而微束X射线荧光分析系统(micro-XRF)因其具有更高的微区分辨率而受到广泛关注。

[0003] 微束X射线荧光分析系统(micro-XRF)通常都需要配备X射线聚焦器件。使用了X射线聚焦器件的X射线荧光分析系统,虽然微区分辨率大幅度提高(通常可以提高一个数量级以上),但计数率会下降,影响了探测灵敏度。已有技术基于X射线毛细管器件的荧光光谱仪(专利号:201010180956.6),使用X射线毛细管器件进行聚焦,微区分辨率通常只能达到几十微米,不仅微区分辨率不够高,且因计数率下降导致探测灵敏度也有一定程度的降低;同时结构复杂、尺寸庞大,无法实现便携。发明人之前也提出了一种便携式微束X射线荧光光谱仪(专利号:201310356270.1,是与本发明最接近的已有技术),用X射线组合折射透镜获得探测微束,虽然微区分辨率大幅度提高,但计数率低,影响了探测灵敏度。

[0004] X射线组合折射透镜是集成型微结构器件,数值口径小,X射线光管发出的光不能全部被组合透镜接收,不仅使得计数率降低、而且浪费了X射线光能量,还增加了噪声。如果能发明新的器件结构,尽可能多的利用X射线光管发出的X射线光,则不仅能大幅度增加计数率、进而提高探测灵敏度,同时还能降低能耗、减小噪声。

发明内容

[0005] 为了克服已有X射线荧光光谱仪微区分辨率还不够高,特别是因计数率低而导致的探测灵敏度不够高,且结构复杂、尺寸庞大、无法实现便携的不足,本发明提供一种用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,将其应用于小型化微束X射线荧光分析系统,可同时实现高微区分辨率和高灵敏度,并可进行现场分析。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0007] 一种用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑,所述X射线光阑包括整形部分和滤波部分,所述整形部分是指利用X射线光阑结构阻隔射入X射线阵列组合折射透镜之外的杂散光并对光束进行初步准直的结构;所述滤波部分是指X射线光阑结构中透光带和阻光带交替布置的滤波结构,并通过滤波结构将X射线光波分裂成多个子光束。

[0008] 进一步,所述透光带的数目为 $(M+1)$ 个,与所述X射线阵列组合折射透镜中组合折射透镜的数目相同。

[0009] 再进一步,所述透光带和阻光带的宽度分别由下列公式计算得出:

[0010] 零级透光带 T_0 ,与X射线组合折射透镜的数值口径尺寸相同,正负一级透光带、正负二级透光带...,依此类推,透光带宽度表示为:

$$[0011] \quad T_M = \frac{T_0}{\cos(0.5M \cdot \theta)} \quad (1)$$

[0012] θ 为X射线阵列组合折射透镜的光轴与阵列中的正负一级X射线组合折射透镜的光轴夹角；

[0013] 正负一级阻光带、正负二级阻光带…，依此类推，阻光带宽度表示为：

$$[0014] \quad G_M = L \cdot \tan(0.5M \cdot \theta) \quad (2)$$

[0015] 其中L代表X射线组合折射透镜的几何长度，表示为 $L = N \cdot l$ ，其中l为折射单元轴向厚度尺寸。

[0016] 更进一步，所述X射线光阑选择吸收特性满足下列公式的任何材料，X射线波段材

$$[0016] \quad \text{料的吸收系数: } \beta = \sum_i \frac{N_A r_0 \lambda^2}{2\pi} \frac{f_2}{A_i} \rho_i \quad (3)$$

[0017] 其中 N_A 代表阿伏伽德罗常数， r_0 代表电子半径， λ 代表波长， A 代表原子质量， f_2 代表原子散射因子， ρ 代表电子密度，下标i代表化合物中的元素种类，当材料为单质是 $i=1$ ；

[0018] 所述X射线光阑的材料厚度t满足表达式 $e^{-\beta \cdot t} \ll 1$ 。

[0019] 本发明的有益效果主要表现在：1、利用所发明的新型器件X射线光阑，对X射线光束进行整形和滤波，结构简单、可一体化批量制作2、X射线阵列组合折射透镜基于折射效应工作，在对X射线束聚焦时不需要折转光路，因此所形成的探测装置或仪器结构紧凑、尺寸小、重量轻，适合制作便携式仪器装置，可以实现现场分析。

附图说明

[0020] 图1是本发明一种微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件中X射线光阑的结构示意图(只画出了 $M \leq 2$ 的局部结构)，其中， T_0 为零级透光带的宽度， T_2 为正负一级透光带的宽度，t为X射线光阑的厚度，(a) 正视图，(b) 俯视图。

[0021] 图2是本发明一种微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的结构示意图，其中1代表X射线光阑、2代表X射线折光器、3代表X射线阵列组合折射透镜、4代表组件承载台。

[0022] 图3是本发明一种微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件中X射线折光器的结构示意图(只画出了 $M \leq 2$ 的局部结构)，其中 T_z 为非折光区的宽度， t_{z0} 为非折光区的材料厚度、 t_{zM} 为折光区的材料厚度，(a) 正视图，(b) 俯视图。

[0023] 图4是本发明一种微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件中X射线阵列组合折射透镜的结构示意图(只画出了 $M \leq 2$ 的局部结构)，其中 T_0 为折射单元的口径、l为折射单元的轴向厚度尺寸。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本发明作进一步描述。

[0025] 参照图1～图4，一种用于微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件的X射线光阑，所述X射线光阑包括整形部分和滤波部分，所述整形部分是指利用X射线光阑结构阻隔射入X射线阵列组合折射透镜之外的杂散光并对光束进行初步准直的结构；所述滤波部分是指X射线光阑结构中透光带和阻光带交替布置的滤波结构，并通过滤波结构将X射线光波分裂成多个子光束。

[0026] 进一步,所述透光带的数目为(M+1)个,与所述X射线阵列组合折射透镜中组合折射透镜的数目相同。

[0027] 再进一步,所述透光带和阻光带的宽度分别由下列公式计算得出:

[0028] 零级透光带 T_0 ,与X射线组合折射透镜的数值口径尺寸相同,正负一级透光带、正负二级透光带...,依此类推,透光带宽度表示为:

$$[0029] \quad T_M = \frac{T_0}{\cos(0.5M \cdot \theta)} \quad (1)$$

[0030] θ 为X射线阵列组合折射透镜的光轴与阵列中的正负一级X射线组合折射透镜的光轴夹角;

[0031] 正负一级阻光带、正负二级阻光带...,依此类推,阻光带宽度表示为:

$$[0032] \quad G_M = L \cdot \tan(0.5M \cdot \theta) \quad (2)$$

[0033] 其中L代表X射线组合折射透镜的几何长度,表示为 $L = N \cdot l$,其中l为折射单元轴向厚度尺寸。

[0034] 更进一步,所述X射线光阑选择吸收特性满足下列公式的任何材料,X射线波段材

$$[0034] \quad \text{料的吸收系数: } \beta = \sum_i \frac{N_A r_0 \lambda^2}{2\pi} \frac{f_2}{A_i} \rho_i \quad (3)$$

[0035] 其中 N_A 代表阿伏伽德罗常数, r_0 代表电子半径, λ 代表波长,A代表原子质量, f_2 代表原子散射因子, ρ 代表电子密度,下标i代表化合物中的元素种类,当材料为单质是 $i=1$;

[0036] 所述X射线光阑的材料厚度t满足表达式 $e^{-\beta \cdot t} < 1$ 。

[0037] 将本发明的X射线光阑应用到微型化X射线阵列组合折射透镜集成组件,所述集成组件包括X射线光阑1、X射线折光器2、X射线阵列组合透镜3和组件承载台4,X射线光束照射在所述X射线阵列组合折射透镜集成组件上,首先被X射线光阑接收,并进行第一次整形和滤波,所述第一次整形是指依据所述X射线阵列组合折射透镜的数值口径,对入射X射线光波进行整形;所述滤波是指将入射X射线光波分裂形成多个子光束,子光束的数目与X射线阵列组合折射透镜中的组合折射透镜数目相同。已分裂成多个子光束的X射线光波接着入射进所述X射线折光器,经X射线折光器进行光束第二次整形,所述光束的第二次整形保证从X射线折光器出射的多个X射线子光束,均以类平行光的方式入射阵列中对应的X射线组合折射透镜。所述X射线阵列组合折射透镜对入射的多个X射线子光束分别进行聚焦,所述X射线阵列组合折射透镜的阵列结构布局,保证每一个子光束所形成的聚焦焦斑在同一位置,并位于光轴上。所述组件承载台用于承载所述X射线光阑、X射线折光器、X射线阵列组合折射透镜,并在所述X射线光阑、X射线折光器、X射线阵列组合折射透镜的相对位置和光轴调整完毕后进行固定。

[0038] 进一步地,所述X射线阵列组合折射透镜中包含(M+1)个X射线组合折射透镜,所述M为正整数且为偶数。所述X射线阵列组合折射透镜沿其光轴呈轴对称分布,所述X射线阵列组合折射透镜的光轴与阵列中零级X射线组合折射透镜的光轴重合,所述X射线阵列组合折射透镜的光轴与阵列中的正负一级X射线组合折射透镜的光轴夹角为 θ ,所述X射线阵列组合折射透镜的光轴与阵列中的正负二级X射线组合折射透镜的光轴夹角为 2θ ,依此类推。

[0039] 再进一步,所述X射线阵列组合折射透镜中(M+1)个组合折射透镜的布局结构,使得所有(M+1)个X射线组合折射透镜聚焦的焦斑在相同位置,且位于光轴上。

[0040] 进一步地,所述(M+1)个X射线组合折射透镜的结构和性能参数,依据下列公式得出:

[0041] X射线波段的光学常数: $n=1-\delta+i\beta$ (4)

[0042] X射线组合折射透镜的焦距: $f=\frac{R}{2N\delta}$ (5)

[0043] X射线组合折射透镜的焦斑尺寸: $\Delta p=\frac{\lambda}{\pi\delta}\sqrt{\frac{\ln 2}{2N}}\sqrt{\mu R}$ (6)

[0044] X射线组合折射透镜的数值口径: $D_{eff}=2R_0\sqrt{\frac{1-e^{-a}}{a}}$ (7)

[0045] 其中n代表光学常数, δ 代表X射线波段材料的折射, β 代表X射线波段材料的吸收,N代表X射线组合折射透镜中折射单元的个数,以抛物面型折射单元为例,组合折射透镜抛物面顶点的曲率半径为R,抛物面的开口尺寸为 R_0 ,f代表X射线组合折射透镜的焦距, λ 代表波长, μ 代表X射线的线吸收系数, $a=\frac{\mu NR_0^2}{R}$ 。

[0046] 更进一步,所述X射线折光器,与所述X射线阵列组合折射透镜贴近放置,实现入射X射线光束的第二次整形,所述第二次整形,是指X射线折光器可对X射线阵列组合折射透镜中的正负一级组合透镜折光 θ 角度,对X射线阵列组合折射透镜中的正负二级组合透镜折光 2θ 角度,依此类推,最终实现对X射线阵列组合折射透镜中每一个单一组合折射透镜的类平行光入射。

[0047] 所述X射线折光器可选择折射特性满足下列公式的任何单质或化合物材料,

[0048] X射线波段材料的折射系数: $\delta=\sum_i \frac{N_A r_0 \lambda^2}{2\pi} \frac{Z_i}{A_i} \rho_i = \frac{N_A r_0 \lambda^2}{2\pi} \cdot \frac{\sum_i v_i Z_i}{\sum_j v_j A_j}$ (8)

[0049] 其中, N_A 代表阿伏伽德罗常数, r_0 代表电子半径, λ 代表波长,A代表原子质量,下标i表示化合物中的元素种类,下标j为正整数, ρ 代表电子密度,下标i表示化合物中的元素种类,当材料为单质时 $i=1$,v代表原子个数,下标i表示化合物中的元素种类,下标j为正整数,Z代表原子序数,下标i表示化合物中的元素种类。

[0050] 所述X射线折光器的非折光区材料厚度用 t_{z0} 表示,为减少X射线吸收损耗,应制作得尽量薄,由制作工艺决定。所述X射线折光器的非折光区宽度尺寸 $T_z=T_0+2G_2$, T_0 为零级透光带的宽度; t_{z0} 为非折光区的材料厚度,折光区的材料厚度 t_{zM} 由下列公式计算得出:

[0051] $t_{zM}=t_{z0}+T_M \cdot \tan(0.5M \cdot \theta)$ (9)。

[0052] 其中, G_2 为正负二级阻光带的宽度,由上述公式(2)取 $M=2$ 时计算得出; T_M 为透光带的宽度,由上述公式(1)计算得出。

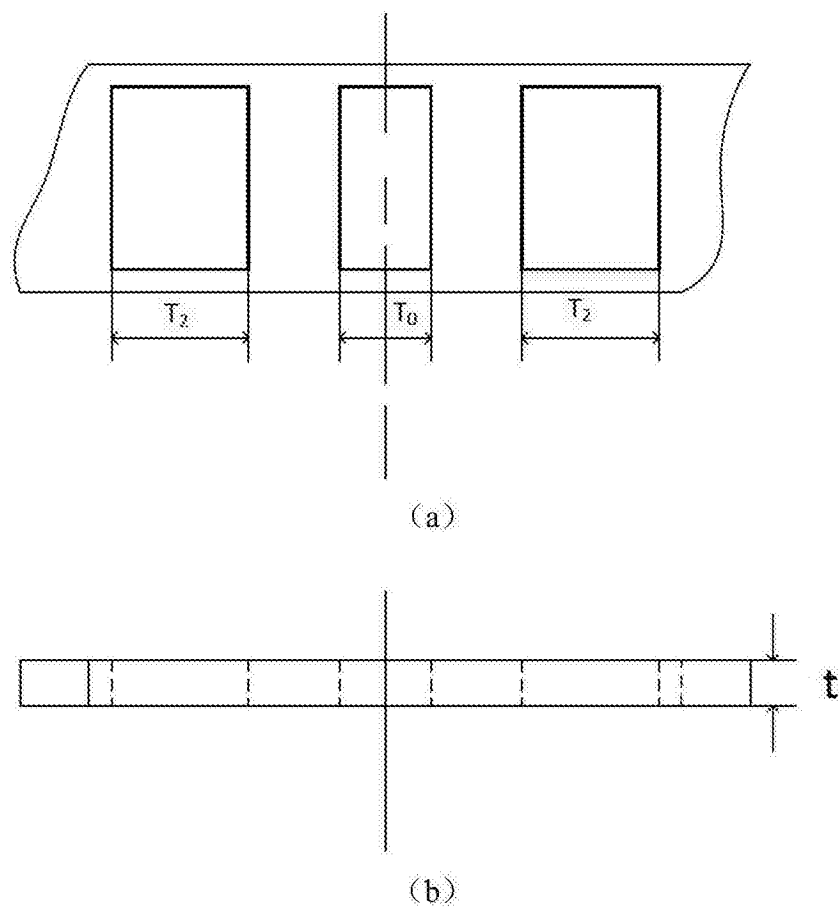


图1

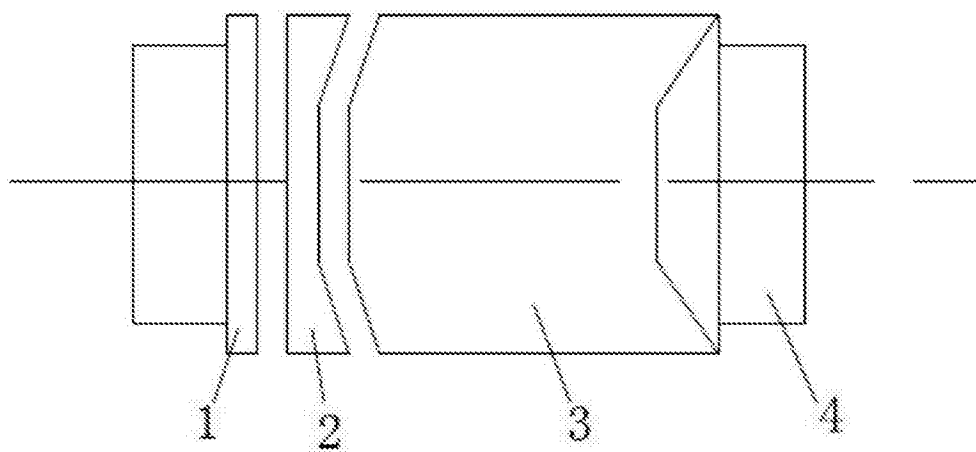


图2

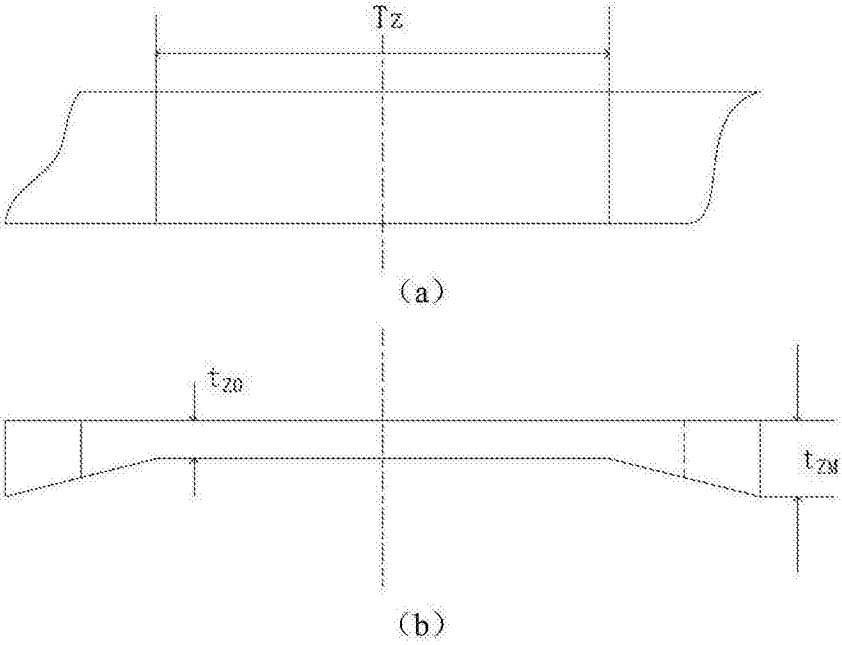


图3

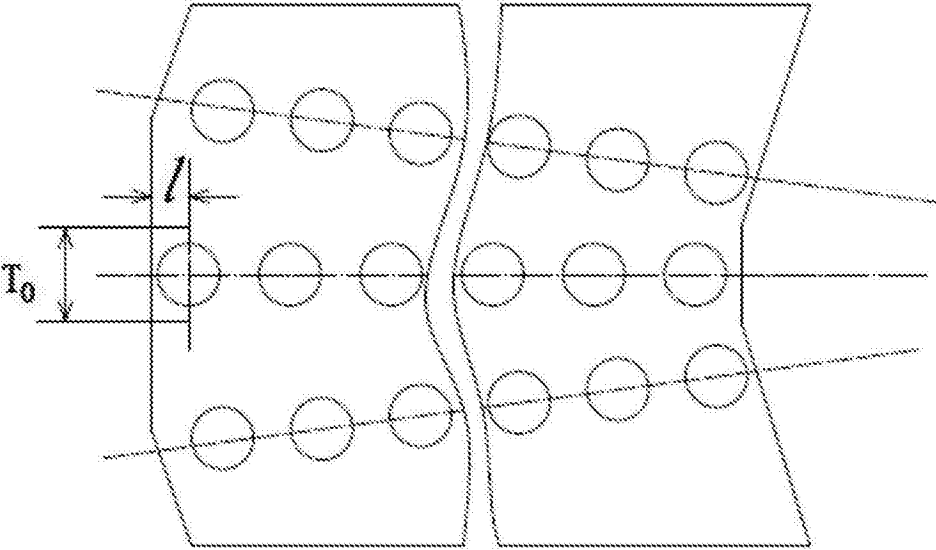


图4